

2025 未来测试技术发展学术会议在成都圆满召开

近日,2025 未来测试技术发展学术会议在成都电子科技大学(清水河校区)成功召开。本次会议由北京方略博华文化传媒有限公司、中国电子学会电子测量与仪器分会主办,电子科技大学承办,优利德科技(中国)股

份有限公司、电子城·(成都)智慧科技创新中心协办。会议汇聚了电子科技大学、哈尔滨工业大学、中国航天科技集团一院一部、深圳市鼎阳科技股份有限公司等 22 个单位共计百余位代表出席了本次会议。



大会合影

本次会议由“人工智能时代背景下未来测试技术的前沿探索与实践”为主题,汇聚国内专家学者、行业领袖及科研团队,围绕毫米波太赫兹收发技术、量子精密测试技术、智能测试技术与仪器等关键技术领域展开深入交流,旨在搭建一个高水平的学术交流平台,推动测试技术的理论突破与实践创新,促进测试技术在多领域的融合与应用,助力我国测试技术迈向国际领先水平。

电子科技大学学术委员会主任、电子测量与仪器分会主任委员王厚军,电子科技大学副校长程玉华,桂林电子科技大学教授陈尚松,重庆大学教授石为人,电子测量与仪器分会副主任委员向天明,桂林航天工业学院副院长、电子测量与仪器分会副主任委员李智,优利德科技(中国)股份有限公司副董事长洪少林,空军工程大学工程学院教授景博,电子测量与仪器分会秘书长郭亚文,电子科技大学自动化工程学院书记张均强,哈尔滨工业大学教授、电子测量与仪器分会副主任委员彭宇,电子科技大学自动化工程学院副院长邱根,电子城·(成都)智慧科技创新中心领导谭黎明等多名专家及委员出席会议。

会议由电子科技大学教授肖寅东主持。电子科技大学副校长程玉华教授为大会致欢迎辞,并对参会嘉宾表示热烈欢迎,并强调本次会议对促进测试技术学术交流与产学研合作的重要意义。中国电子学会电子测量与仪器分会副主任委员向天明回顾了电子测量与仪器分会的发展历程,并展望了未来测试技术的广阔前景。

大会邀请到 6 位知名专家作主题报告,分享最新研究成果:

电子科技大学教授张波深入探讨了全固态太赫兹收发前端关键技术与应用。涵盖太赫兹半导体器件建模、高效倍频发射、宽带混频接收等前沿技术,推动太赫兹技术向更高频段拓展。中国电子科技集团公司第四十一研究所研究员韩顺利系统介绍了量子精密测试技术研究进展。从传统仪器保障到量子测试仪器研发,助力我国量

子信息技术工程化应用。深圳市鼎阳科技股份有限公司高级工程师宋民分析了国产示波器发展现状及未来趋势,探讨如何提升国产高端测试仪器竞争力及对相关产业链的潜在贡献和需求分析。中电科思忆科技股份有限公司研究员周钦山阐述了电子测量仪器智能化发展的驱动因素和面临的挑战,对比国内现状,描绘智能测量仪器的特征和核心技术,并展望未来发展趋势。工信部电子第五研究所高级工程师邵鄂重点探讨了电气互连系统(EWIS)在航空航天、电动汽车及轨道交通等领域的电磁耦合机理与屏蔽效能关键技术,系统梳理了屏蔽效能表征参数、测量技术发展趋势及典型案例。电子科技大学教授杨扩军分析了传统数字示波器在测试精度、偶发异常信号捕获、信号智能分析三方面的局限性,进而提出如何利用人工智能相关技术,在超宽带数字示波器中在硬件资源不变的情况下提升测试能力。

会后,参会代表参观了电子科技大学博物馆。馆内展示了电子信息领域的发展历程、重要科技成果及创新应用。通过实地参观,参会代表更直观地了解了电子科技大学在电子信息领域的深厚积淀,对电子科技大学的科研实力和人才培养成果给予了高度评价。

本次会议的成功举办,不仅为测试技术领域的专家学者提供了深度交流的平台,更展现了我国在高端测试仪器研发与智能化升级方面的强劲实力。专家们一致认为,在人工智能、量子科技等新兴技术的驱动下,测试技术正迎来前所未有的发展机遇,需进一步加强“产学研用”协同创新,突破关键核心技术,推动国产高端测试仪器迈向世界一流水平。相信在各位学者的共同努力下,测试技术的发展将迎来更加美好的未来!

未来,中国电子学会电子测量与仪器分会将继续发挥桥梁纽带作用,凝聚行业智慧,推动测试技术创新与成果转化,为我国科技自立自强和高端装备制造业高质量发展助力。